

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE,
DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR L'ETAT CONDENSE,
LES ATOMES ET LES MOLECULES,
SERVICE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES SURFACES ET DES INTERFACES

SEMINAIRE

Vendredi 25 Janvier 2008 à 11h00

Bâtiment 466, salle 111 - CEA Saclay, 91191, Gif sur Yvette

SixS : une nouvelle ligne de diffraction de surface à SOLEIL

Y. GARREAU

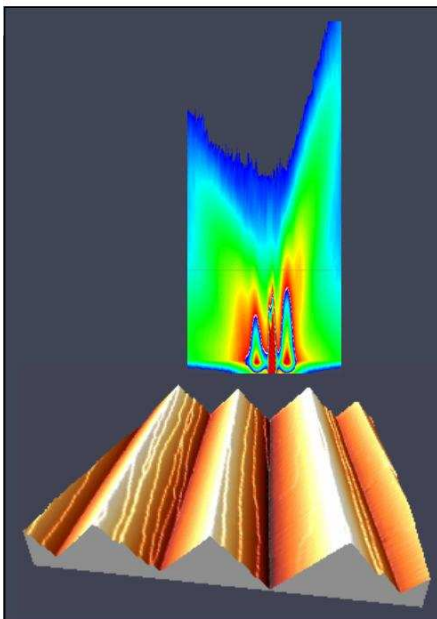
*Synchrotron-Soleil. L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48, F-91192
Gif-sur-Yvette Cedex*

*MPQ, Université Paris Diderot, Bât Condorcet, Case courrier 7021, F-
75205 Paris Cedex 13*

Invité par L. Barbier

Résumé:

La diffraction de rayons X en incidence rasante est une technique particulièrement bien adaptée pour étudier la structure au voisinage des surfaces ou des interfaces. Les informations qu'elle apporte sont essentiellement de trois types et peuvent se résumer de la façon suivante : la forme d'une tâche de diffusion nous renseigne sur la morphologie de la surface ou sur les formes des objets dans le cas de nano structures ; les positions des maxima d'intensité nous informent sur les différentes périodicités présentes en surface (reconstructions, répartitions d'objets sur des échelles pouvant aller jusqu'au \square m....) et finalement une analyse quantitative de l'intensité diffusée peut nous révéler la structure atomique du système étudié. Après une illustration de ces différents points, le projet « SixS » d'une nouvelle ligne de lumière dédiée aux études des surfaces par diffraction auprès du nouveau centre de rayonnement synchrotron SOLEIL sera présenté.



*** SERA PRECEDE D'UNE PAUSE
CAFE A PARTIR DE 10H30**